

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

51384

Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 05.III.1965 (P 107 786)

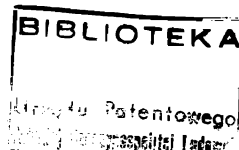
Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 20.VII.1966

Kl. 42 1, 3/08

MKP G 01 n 27/62

UKD



Twórca wynalazku: mgr Stanisław Gregorczyk

Właściciel patentu: Huta Baildon, Katowice (Polska)

Sposób przygotowania próbek do analizy spektralnej

1

Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania próbek do analizy spektralnej.

Do wykonania analizy spektralnej stosuje się próbki posiadające badaną powierzchnię średnicy minimum 7 mm, objętości minimum 60 mm³ i grubości minimum 3 mm.

Próbki płaskie kładzie się na jednej z elektrod, próbki walcowe umocowuje się w uchwytach; próbkom nieforemnym nadaje się kształt przez szlifowanie.

Próbki o wymiarach mniejszych niż wyżej podano rozpuszcza się i następnie nanosi określoną ilość roztworu na elektrodę węglową.

Sposób wg wynalazku umożliwia analizę próbek małych bez konieczności stosowania skomplikowanej metody powlekania elektrod węglowych, oraz badania seryjne.

Sposobem według wynalazku do badań stosuje się

2

próbki z materiałów jednorodnych lub pastylki z prasowanych proszków niemetalicznych z grafitem, posiadające jedną powierzchnię płaską o średnicy minimum 7 mm. Próbki układa się na płycie metalowej badaną powierzchnią na dół, w ramce niklowej i zalewa niskotopliwym metalem, jak na przykład cyną lub stopem Wooda. Po przeprowadzeniu badania roztopia się metal i wyjmuje próbki.

Ponadto sposób wg wynalazku umożliwia dobry odpływ ciepła, co eliminuje błędy wywołane nagrzaniem się próbki w czasie badania.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób przygotowania próbek do analizy spektralnej, **znamienny tym**, że próbki umieszczone w ramce niklowej zalewa się niskotopliwym metalem.